2019B1847

BL46XU

鉄上に形成するウスタイト皮膜の相変態に伴う皮膜中の応力変化挙動 II Stress Development Accompaned with the Phase Transformation of Thermally Grown Oxide Scale of FeO formed on Fe at High Temperature II

<u>林</u>重成^a, 山ノ内 友里香^a, 林 功補^b, 日高 康善^b <u>Shigenari Hayashi^a</u>, Yurika Yamanouchi^a, Kousuke Hayashi^b, and Yasuyoshi Hidaka^b

> ^a 北海道大学, ^b 日本製鉄株式会社 ^aHokkaido University, ^bNippon Steel Corporation.

純鉄上に高温酸化により形成するウスタイト皮膜(FeO)が等温相変態(Fe₃O₄の析出+共析変態)する際に導入される変態応力の酸化皮膜中の厚さ方向分布の時間変化を、侵入深さ制御 sin² w 法を用いてその場測定するための実験条件の確立を行った。本測定に先立って実施した 2019A1811 期実験では、X線のエネルギー = 30 keV, PILATUS 2M を用いた条件下で実施したが、酸化皮膜中の応力の面内分布の不均一性と、Fe₃O₄の十分な回折ピークシフトが 30 keV では確保出来なかっため、満足な結果が得られなかった。今回の測定では、X線のエネルギーを 7 keV とし、多軸回折計アームへの設置が可能な PILATUS 300K を用いた測定を行うことで、皮膜中に導入される変態応力の厚さ方向の分布を十分な精度で測定できた。この結果により、酸化皮膜中の応力の厚さ方向分布をその場観察する手法が確立された。

キーワード: ウスタイト皮膜、共析変態、変態応力、侵入深さ制御 sin² ψ 法、その場観察

背景と研究目的:

炭素鋼板表面に熱間圧延中に形成する FeO を主体とする酸化皮膜は、圧延後の徐冷中に共析反応 (FeO→Fe+Fe₃O₄)し、黒皮と呼ばれる美観を持つ酸化皮膜へと変化する。黒皮皮膜は鋼製品の美観 や短期間の防食を担うが、相変態に伴って皮膜中に導入される残留応力により、酸化皮膜のはく離や クラック等には欠陥が生じることがあるため、鋼の表面品質向上のためには、相変態に伴う残留応力 の発生やその変化を理解する必要がある。

著者らは酸化皮膜中に導入される応力を厚さ方向に分解し、その応力分布の相変態中の変化をその 場測定することを目的に研究を進めており、これまでに、放射光を用いた侵入深さ制御 $sin^2 \psi$ 法と高 温その場測定技術の組み合わせによる測定技術の確立を進めてきた。2019A1811 の実験では、その場 測定に必須となる 2 次元検出器を用いた測定法の確立を目的として、純鉄上に予め高温酸化皮膜を形 成させ、それを相変態させた試料を測定試料として、X 線のエネルギー = 30 keV, シンチレーション カウンターによる侵入深さ制御 $sin^2 \psi$ 法による応力測定を室温にて行って、残留応力の厚さ方向応力 分布を測定するとともに、PLATUS 2M を用いた 2 次元測定にて同一試料を測定し、2 次元測定でも 0 次元測定と同等の精度で応力分布が評価可能かを確認する検討を行った。その結果、2 次元検出器を 用いた場合、(1)角度分解能の確保のため、試料上の照射面積を絞る必要があり、そのため皮膜の残留 応力に生じていると予想される面内分布の不均一性を平均化することができなかった。(2)この不均一 性に起因する回折ピークプロファイルの歪みにより測定結果には大きな誤差が生じた。(3)X 線エネル ギー = 30 keV では、Fe₃O₄相に生じている歪みが小さいためこの回折角では十分なピークシフトを確 保できなかった。これら主に 3 点の問題のため、0 次元測定の場合と比較して 2 次元検出器を用いた 測定からは、妥当な応力測定結果を得ることができなかった。

そこで、本測定では、使用する X 線のエネルギーを Fe K 吸収端直下の 6.92 keV にするとともに、 残留応力の面内不均一性を平均化するため、試料の面内併進揺動を併用することにより、前回の測定 で明らかとなった問題を解決し、その場測定手段の確立を行うことを目的とした。

実験:

試料には純鉄上に予め大気中, 700℃, 15 min で厚さ約 30 µm の酸化皮膜を形成し、その後、室温ま

で冷却後に 380℃で 5 min あるいは 60 min 相変態させた試料と、室温に冷却せずに直接 380℃まで冷却後に 5 min あるい 60 min 相変態させた 4 種類の試料を用いた。測定は室温で行った。測定は、 BL46XU の多軸回折計を用い、2 種類の ψ 角制御方法(並傾法: ω 軸制御、側傾法: χ 軸制御)を組み 合わせることにより ψ 角変更時の材料への X 線侵入深さを任意の深さで一定に保つように制御した 侵入深さ制御 sin² ψ 法により酸化皮膜中の応力測定を行った。X 線のエネルギーは 6.92 keV を用いた。 また、試料位置の面内併進揺動を用い、検出器アームに設置した PILATUS 300K(カメラ長 = 936.94 mm)を用いて 20=70-120°で回折信号を取得した。また、データの妥当性の検討のため、0 次元検出器

(NaI シンチレーションカウンター)及びダブルスリットによる平行光学系を用いた従来の侵入深さ sin² ψ 法を用いた測定も実施した。

結果および考察:

Fig. 1 に 700[°]C, 15 min 等温酸化後に直接 380[°]Cで 60 min 等温変態させた試料の室温 における 0 次元および 2 次元検出器を用い た X 線侵入深さ制御測定結果 (Fe₃O₄ 004 の回折角 vs. sin² ψ)を比較して示す。グラ フの右肩の数値は、各測定条件で設定した X 線侵入深さを、今回の実験条件で 004 回 折ビーク測定で設定できる最大の X 線侵 入深さ (正反射の測定条件: $\psi = 0^{\circ}$)に対 する比で示している。0 次元および 2 次元 測定の結果は良く一致したと判断される。 従って、今回の条件下においては、2 次元 検出器を用いた X 線深さ制御法による応 力測定が可能であることが示されたと言 える。

Fig. 2 は、0 次元および 2 次元検出器を 用いて、Fe₃O₄の異なる面指数を用いて測 定した酸化皮膜中の応力の X 線侵入深さ 依存性を示す。横軸は、各データの測定条 件での X 線侵入深さを示す。この X 線侵 入深さは酸化皮膜組成が Fe₃O₄ であるとみ

なして見積もった酸化皮膜に対する X 線侵入長(X 線の減衰が 1/e になる光路長) =44.5 μ m を用いて算出した。また、縦軸の *M* は、以下に示す sin² ψ 法による応力 測定の基本式の傾きである。

$$\sigma_{\Phi} = \left(\frac{E}{1+\nu}\right) \frac{\partial \frac{\Delta d}{d_0}}{\partial \sin^2 \psi}$$

$$M = \frac{\partial_{d_0}^{\Delta d}}{\partial sin^2 \psi} \quad (\Delta d = d_{\psi} - d_0)$$

ここで、 σ_{φ} は主応力 $\sigma_{1} \geq \varphi$ の角度を持つ方向の試料表 面に平行な方向の残留応力、 $E \geq v$ はそれぞれ材料の縦 弾性係数とポアソン比であり、 d_{ψ} は試料表面の法線ベ クトルに対して、傾き ψ の法線ベクトルを持つ回折面 の面間隔であり、 d_{0} は $\psi = 0$ の面間隔である。Fig. 2 よ り酸化皮膜中には表面には引張応力が作用しており、 より内側では圧縮応力へと遷移すること、さらに圧縮 応力レベルは、より酸化皮膜中の深い領域で増加する



Fig. 1 Fe 上に形成させた酸化皮膜の 0 次元および 2 次 元検出器を用いた X 線深さ制御法による測定結果



Fig. 20次元および2次元検出器を用い て測定した Fe 上に形成させた酸化皮膜 中の残留応力(傾き M)の X 線侵入深さ 依存性

ことが分かった。また、2次元測定から得られた結果は、0次元測定結果と良く一致するとともに、異なる面指数の格子面から得られた測定結果もほぼ一致しており、今回用いた条件下では、X線侵入深さ制御 sin² # 法により、皮膜中の残留応力を精度良く測定できることが明らかになった。すなわち、本条件により今後の高温その場測定が可能になったと言える。

今後の課題:

本研究で確立したその場観察手法は、1 測定に約3分間の測定時間を要する。従って、X 線侵入深 さを4 水準として測定した場合、合計で最低でも12分の測定時間が必要となる。これまでの実験室 系高温 XRD で実施した FeO 皮膜の相変態検討結果からは、相変態は比較的短時間で進行することが 明らかになっており、12分毎の測定では相変態に伴う応力変化を詳細に検討するためには長すぎるた め、4 水準の侵入深さ制御測定を1 試料に対して行うには時間分解能が不足する。従って、異なる深 さ水準における応力測定のための今後の課題としては、この時間分解能の向上である。次回の測定で は、X 線侵入深さを一試料当たり1水準としてその場測定を行い、各厚さ水準毎に複数の試料を用い る必要があると考えられる。